

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2002-22630  
(P2002-22630A)

(43) 公開日 平成14年1月23日 (2002.1.23)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 0 1 N	3/20	G 0 1 N	2 G 0 5 2
	1/28		2 G 0 6 1
	3/08		Z
	3/32		A
	11/00		1 0 3
		37/00	

審査請求 有 請求項の数58 O L (全 31 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-156483(P2001-156483)

(22) 出願日 平成13年5月25日 (2001.5.25)

(31) 優先権主張番号 09/580024

(32) 優先日 平成12年5月26日 (2000.5.26)

(33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 500371891  
サイミックス テクノロジーズ、インク  
アメリカ合衆国、カリフォルニア州  
95051、サンタクララ、セントラルエクス  
プレスウェイ、3100番

(72) 発明者 ダミアン、ハジューク  
アメリカ合衆国、カリフォルニア州  
95125、サンノゼ、プレイスストリート  
1146番

(74) 代理人 100095407  
弁理士 木村 満 (外5名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高スループットの材料の物理特性測定装置及びこれを用いた測定方法

(57) 【要約】

【課題】 高いスループットの組み合わせライブラリのスクリーニング用多目的装置等を提供する。

【解決手段】 この装置は、ライブラリの構成要素を保持するサンプルホルダと、独立したライブラリ構成要素を機械的に摂動するプローブの配列と、ライブラリ構成要素それぞれの機械的摂動に対する応答を測定するセンサの配列とを含む。スクリーニング中、この装置は、サンプル配列 (サンプルホルダ) とプローブの配列とを置換することにより、独立したライブラリ構成要素を機械的に摂動する。ヤング率 (曲げ、一軸延伸、二軸圧縮、剪断)、硬度 (インデンテーション)、破壊 (破壊時の応力と歪み、靱性)、接着 (タック性、ルーパタック性)、及び流れ (粘度、メルトフローインデックス、レオロジー) その他を含む、多数の異なるバルクな物理特性に基づいて、材料サンプルをスクリーニングする。

